

smartWLI

便携式白光干涉三维轮廓仪

非接触三维形貌测量技术



- 灵活便携
- 精度高
- 测速快
- 稳定可靠

白光干涉测量技术广泛应用于光滑与粗糙表面的三维形貌表征。垂直方向的测量精度可以达到纳米级别。

SmartWLI - 便携式白光干涉三维轮廓仪，专用于大尺寸部件表面形貌测量与分析。仪器操作简单，测量时放置于样品表面；独有的三脚支架结构，方便曲面部件测量；外接笔记本电脑完成数据分析，测量结果立体直观呈现。

SmartWLI - 便携式白光干涉三维轮廓仪外形紧凑、结构稳固，轻松应对多种测量环境；测速快，精度高，为工业用户提供最优化的产品表面形貌测量条件，适用于产品工艺控制与质量管理。



WinWinTec



测量系统				
量测原理	白光干涉			
Z 轴定位系统	压电效应调节系统			
高度量测范围	最大可达 400 μm			
干涉物镜系统	放大倍数	视场范围 (μm^2)	最小可分辨横向宽度 (μm)	工作距离 (mm)
	10 \times	480 \times 360	1.20	7.4
	20 \times	320 \times 240	0.90	4.7
	注：上述数据皆为估算值。			
垂直分辨率	小于 1 nm			
光源系统	LED			
外观尺寸	270 mm (高) \times 127 mm (宽) \times 165 mm (长)			
毛重	3 Kg			
	约值，取决于具体配置。			
操作界面	笔记本电脑、Windows 7 操作系统、DVD 刻录。			
量测时间	通常小于 1 分钟			
软件系统				
SmartWLI	基于微软 Win7 操作系统，64 位表面形貌测量软件、三维数据可通过接口直接传输至 MountainsMap® 分析软件。			
MountainsMap®	三维数据分析软件，轮廓及三维影像结果输出、测量数据预处理及后处理、德标 (DIN) 欧标 (EN) ISO 标准粗糙度及高度测定、串行处理及测试日志。			
输出文件格式	ASCII, SUR, BCR-STM, BMP, JPEG, TIF			

(2012 年 4 月技术数据)

更多 SmarWLI 系列白光干涉三维轮廓仪产品信息，
请访问 [www. WinWinTec.com](http://www.WinWinTec.com) 与 www.smartWLI.de

德国 WinWinTec 公司北京代表处 (德国 GBS 公司中国市场渠道商)

地址：北京市海淀区农大南路 1 号硅谷亮城 2B 座 220 室 电话：+86 10 6266 7685 传真：+86 10 6266 7685

手机：+86 185 0046 5572 邮箱：leonzhu@winwintec.com / kristin.petrasch@winwintec.com